

Application/Control	No.
09/544.054	

Examiner

Christopher E. Lee

Applicant(s)/Patent under Reexamination YONA ET AL.

Art Unit 

		ORIGINAL	<del>-</del>	ISSU	E CL	<u> AS</u>	SIF								
		INTERNATIONAL CLASSIFICATION													
	CLASS		CLAIMED						NON-CLAIMED						
710 3			07	. G	06	F	13	1	40	н	03	к	19	/007	
1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CRO	SS REFEREN		G	G 08	C 15		/00						,	
CLASS	SUBCL	ASS (ONE SU	JBCLASS P	ER BLOCK)		00		15		00					
710	316							1				-		1	
370	233	395.21							1	1				1	
375	240								1						/
	1								1						/
													i		/
Enere	istant Exam	llea.	rophe.	E.1	E. Lee 3/16/06					O.G. Print Claim(s)					
				(Plima	ry Exami	ner)		(Date)							1B
Claim	s renumb	bered in th	ie same	order as p	resent	ted by	y appl	icant	□с	PA		т	.D.		☐ R.1.4
Final Original		Final Original		Final 9 Original		Final	01 Original		Final	Driginal		Final	Original		Final Original
1 2	- T	32	<del> </del>	62			92	1		122		-	152	1	18
3		33		63			93			123			153	]	18
4		34	ļ  _	64			94	4 }		124		ļ <u>.</u>	154	_	18
5 6		35	-	65 66			95 96	1		125 126		-	155 156	-	18
$\frac{1}{7}$		37	<del> </del>	67	.		97	1		127			157	1	18
8		38		68			98	] [		128	-		158	]	18
9		<del></del> 39		69			99			129		<u> </u>	159		18
10	-   -	2 40 3 41	-	70	}		100	- - -		130 131			160 161	-	19
1 12	-   -	3 41 4 42	┧. ├	72	}		101	┤ ├		132			162	1	19
13		5 43		73			103	j		133			163	]	19
14		6 44		74			104	] [		134			164	_	19
15		7 45	┨	75			105			135			165		19
16		8 46 9 47	$\vdash$	76 77			106			136 137			166 167	_	19
18		10 48	1	78			108			138			168		19
19	] -=	<b>—</b> 49		79			109			139			169		19
20		50	-	80			110	-		140		ļ	170	1	20
21		51 52	┥ ├	81 82			111			141 142		-	171	-	20
23		53	1  -	83			113			143		<b>.</b>	173		20
12 24		54	] [	84			114	] [		144			174		20
13 25		55		85			115			145			175		20
14 26		56	<del> </del>	86			116			146		-	176		20
15 27 16 28		57 58	<del> </del>	87 88		_	117	<b>-</b> -		147 148		<del> </del>	177		20
17 20		50	₁ ⊢	80	}		110			140	1		170	-{	20